

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- А. Д. Болычевцев (Украина), Л. А. Болычевцева (Россия).** Однопараметрический измерительный контроль. Системный подход к анализу типовых структур 3
- О. Р. Кузичкин, Н. В. Дорофеев.** Анализ алгоритмических ошибок и погрешностей при регрессионной обработке геомагнитных измерений 18
- О. М. Епанчинцева.** Некоторые проблемы поверки цифровых и микропроцессорных приборов 27

ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- Д. С. Беневоленский, Н. Л. Истомина, А. А. Лисов, М. В. Спыну.** Совершенствование методики измерения геометрических размеров в субмикронном диапазоне на основе компьютерного моделирования дифракционного спектра 32